



Program pro automatizovanou pro lokalizaci prasklin zatížených tranzistorových buněk

Götthans, T., Dřínovský, J., Petržela, J., Šotner, R., Kratochvíl, T.

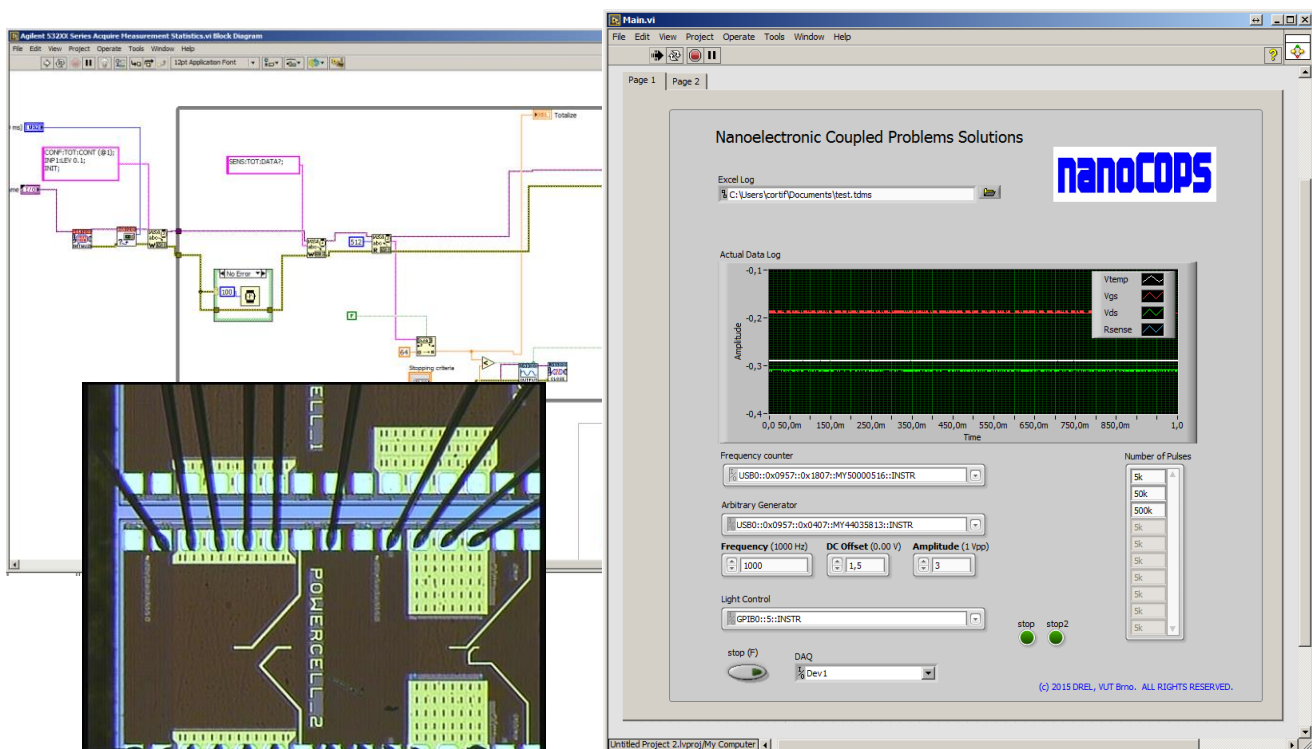
FP7-ICT č. 619166 - Nanoelectronic COupled Problems Solutions (nanoCOPS)

LO1401 - INWITE

FEKT-S-14-2483 – Pokročilé mikrovlnné technologie

Datum: 2015-06-30

Abstrakt – Program vznikl v prostředí LABVIEW. Primárně je určen k měření výkonových MOS tranzistorových buněk poskytnutý společností ONN Belgium. Program ovládá přes GPIB, Ethernet, PCI-e a USB generátor pulzů (s nastavitelným napětím, střídou, polaritou), dále čítač pulzů, dva napěťové zdroje, vysokorychlostní akviziční jednotku a HD kameru připojenou k mikroskopu. Program naměřená data zaznamenává do souboru Excel pro následnou analýzu. Kvalita obrazu z kamery je vylepšena zprůměrováním 100 obrazů.



Obr. 1: Grafické uživatelské rozhraní programu pro měření tranzistorových buněk.